

針對內建人工智慧之車用晶片且以[零故障]為目標之智慧型測試方式
Monthly meeting

時間：2022年5月13日(星期五)下午4:00~5:00

參加者：

清華大學 黃錫瑜 教授
林昂德 碩士生
楊舜華 碩士生
林科宏 碩士生
蘇永全 碩士生
王逸生 碩士生
賴淇 碩士生
交通大學 溫宏斌 教授
王品棠 DRI
中山大學 李淑敏 教授
李建德 DRI
彰師大 黃宗柱 教授
傅筱雯 DRI

議程：

- (1) 專題分享 - 中山大學
 - I. 主題 - Semi-Supervised Framework for Wafer Defect Supervised Pattern Recognition with Enhanced Labeling
 - II. 主講者 - 陳立揚
- (2) General project discussion

下次月會綱要:

- (1) 舉行時間：2022/05/27
- (2) 舉行方式：google meet 線上會議
- (3) 技術分享(彰化師範大學)
 - I. Error Correction Quantized Neural Network(主講者：蔡政諱)
 - II. AN-Coded Redundant Residue Number System for Reliable Neural Networks(主講者：傅筱雯)
 - III. Error Correctable Range-Addressable Lookup for Any Activation Function of Neural Networks(主講者：陳亭羽)
- (4) General project discussion